

10:30 – 11:00

Rejestracja Uczestników

11:00 – 11:05

Powitanie Gości  
Jerzy Józwiak

11:05 – 11:15

Wystąpienie Dyrektora Generalnego GUM  
Piotr Ziółkowski

11:15 – 12:15

Sesja I Moderator: Katarzyna Zawada-Wewiór

- **Ewa Bulska**  
„Spójność pomiarowa jako narzędzie wspomagające rozwój innowacyjnych technologii”
- **Mirosław Pajor**  
„Cyfrowy bliźniak obrabiarki CNC wspomagany technologią AI”
- **Kamil Jonak**  
„Rola sztucznej inteligencji w rozwoju współczesnej metrologii”
- **Rafał Józwiak**  
„Metrologia w obrazowaniu medycznym: jak mierzalność i niepewność budują zaufanie do AI”

12:15 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Sesja II Moderator: Katarzyna Zawada-Wewiór

- **Anna Timofiejczuk**  
„Od pomiaru do innowacji - jak metrologia buduje zaufanie do technologii w erze AI”
- **Marcin Kwiatkowski**  
„MetroHalucynacje - jak szum pomiarowy powoduje halucynacje AI”
- **Dariusz Brzozowski**  
„Nowoczesna metrologia dla przemysłu przyszłości wspomagana AI”
- **Dariusz Knapik**  
„Aspekty metrologiczne inteligentnych sensorów drgań z analizą danych wspomagana sztuczną inteligencją w diagnostyce i monitoringu obiektów inżynierskich”

13:30 – 14:00

Spotkanie Klastra Metrologicznego  
Koordynator: Urszula Wasińska

14:00 – 15:00

Sesja III Moderator: Katarzyna Zawada-Wewiór

- **Tomasz Kozior**  
„Standaryzacja w Druku 3D - metrologiczne aspekty AI”
- **Marcin Krawczyk**  
„Nowoczesne metody oceny niepewności pomiarów wspomaganymi AI i ich znaczenie dla rozwoju technologicznego”
- **Konrad Kobiela**  
„Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej - perspektywy rozwoju wspomaganymi narzędziami sztucznej inteligencji”
- **Jakub Karasiński**  
„Projekty realizowane na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Polska Metrologia II”

15:00

Zakończenie Seminarium  
Jerzy Józwiak